Se	earch	Notes	

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	_
10/700,085	CHEN ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Cuong Q. Nguyen	2811	

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
257	317. 353 431-442	3-19-06	examiner
	431-442	у	Ÿ
-			

8ee INT	ERFERENC	E SEARCH	ED note.
Class	Subclass	Date	Examiner
	<u> </u>		
L		L	l

(INCLUDING SEARC	CH STRATEGY)
	DATE	EXMR
•		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		-
·		
		ļ